

結晶Si太陽電池の拡散層評価

ドーパントの定量評価およびキャリアの分布評価

測定法 : SIMS・SCM・研磨・解体
 製品分野 : 太陽電池
 分析目的 : 微量濃度評価・形状評価・製品調査

概要

裏面電極型結晶Si太陽電池(バックコンタクト型Si太陽電池)において、電極直下のドーパントの濃度分布を定量的に評価した事例をご紹介します。また、キャリアの分布評価を行うことで、p/nの極性判定や空乏層を断面方向から可視化することが可能です。

データ

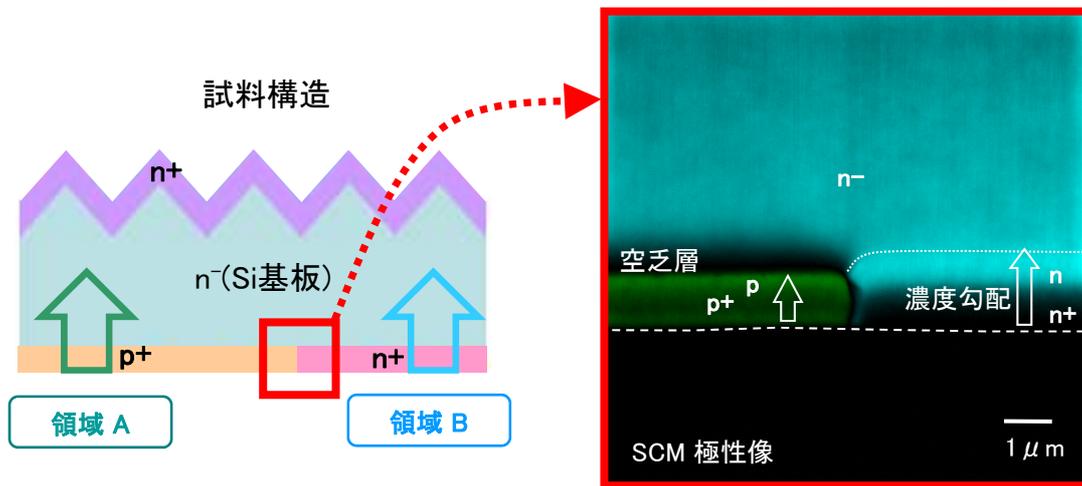


図1 拡散層のキャリア分布(SCM像)

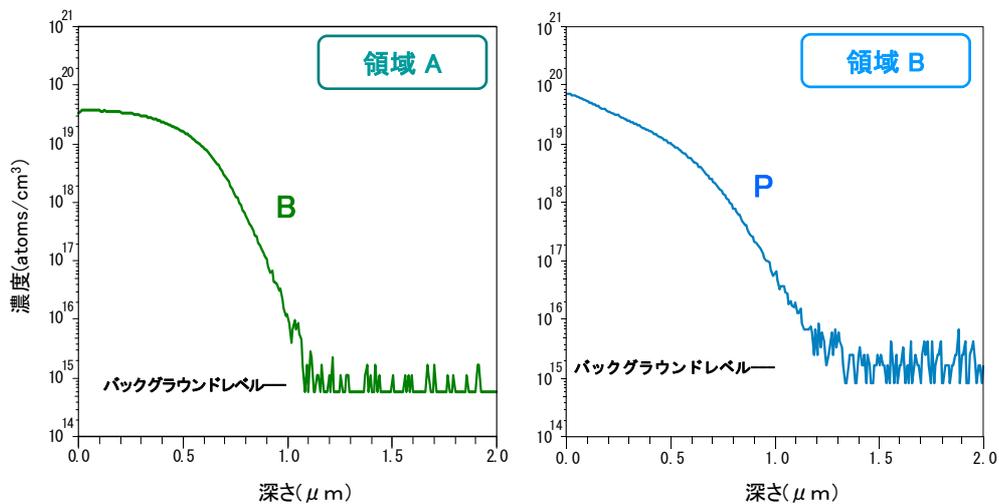


図2 ドーパントの深さ方向濃度分布(SIMS)

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <http://www.mst.or.jp/>